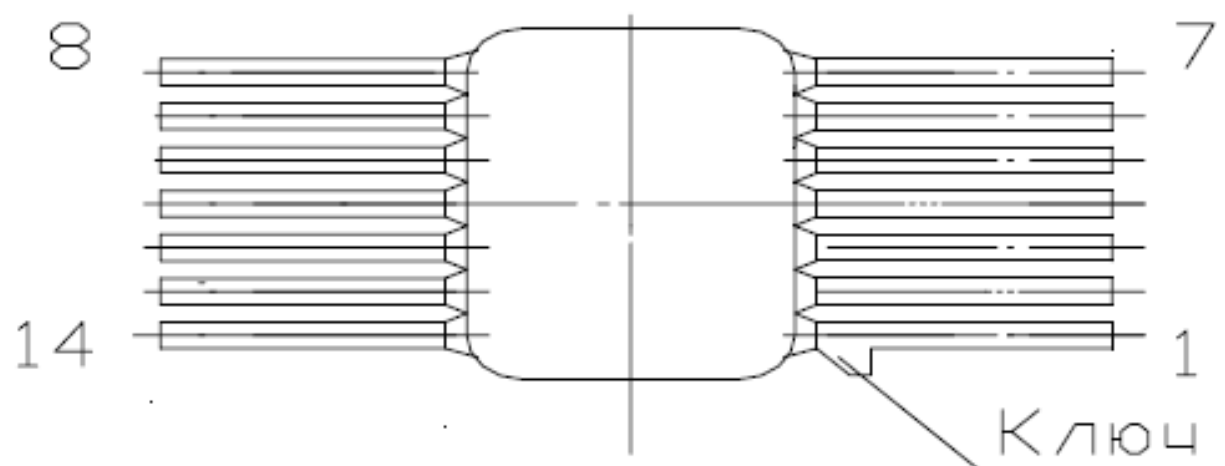


# ЭТИКЕТКА

САРЛ.431130.030 ЭТ2

Микросхемы интегральные 198НТ2АТВК, 198НТ2БТВК, 198НТ2АТ1ВК, 198НТ2БТ1ВК, ОСМ198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК – матрица транзисторов NPN типа.

## Схема расположения выводов

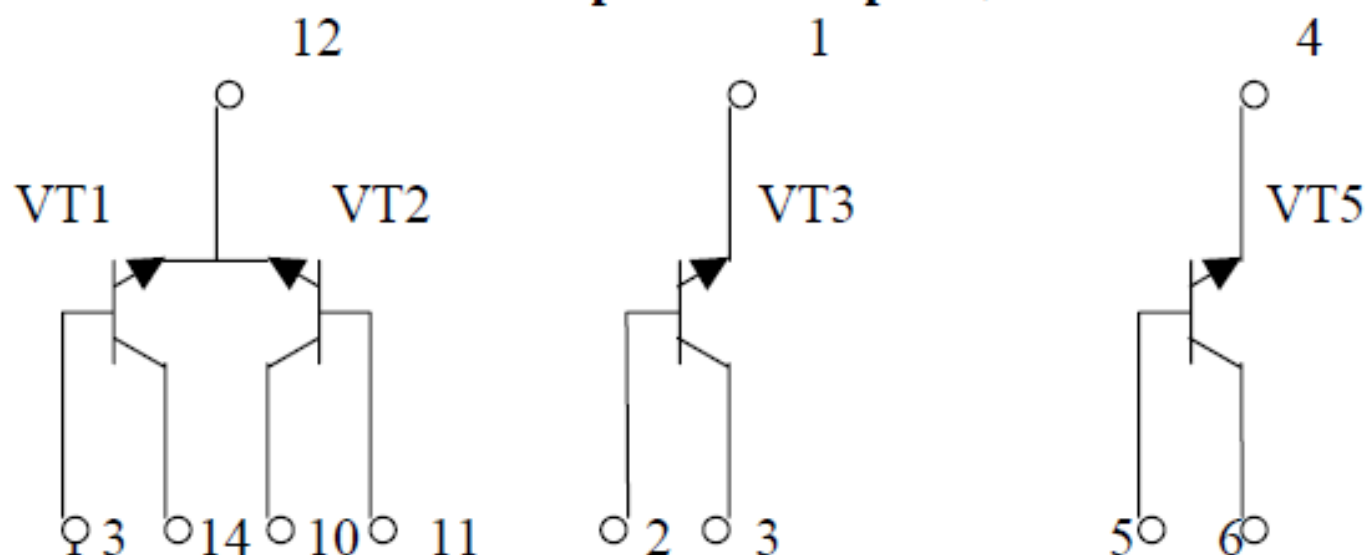


Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

## Схема электрическая принципиальная



**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**  
при температуре ( 25±5 ) °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Бук- вен- ное обоз- наче- ние	Норма			
		198НТ2АТВК 198НТ2АТ1ВК ОСМ198НТ2АТ1ВК		198НТ2БТВК 198НТ2БТ1ВК ОСМ198НТ2БТ1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока при: $U_{CB} = -3$ В; $I_E = -0,5$ мА	$h_{21E}$	30	200	30	200
Обратный ток эмиттера, нА	$I_{EBO}$	-	100	-	100
Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB} = 6$ В	$I_{CBO}$	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА	$U_{BEsat}$	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА	$U_{CEsat}$	-	0,2	-	0,2
Разброс статических коэффициентов передачи тока (транзисторов VT1 VT2) ,%, при: $U_{CB} = 3$ В; $I_B = -0,5$ мА	$\Delta h_{21E}$	-	15	-	15
Разброс напряжения база- эмиттер (транзисторов VT1 VT2), мВ, при: $U_{CB} = 3$ В; $\Sigma I_E = 0,5$ мА	$\Delta U_{BE}$	-	3	-	10
Ток утечки, нА	$I_L$	-	50	-	50

---

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:  
- золото

Цветных металлов не содержится.

### **НАДЕЖНОСТЬ**

Минимальная наработка ( $T_{нм}$ ) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при напряжениях, токах и мощностях, не превышающих 60 % от предельных значений – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс ( $T_{р\gamma}$ ) микросхем при  $\gamma=95\%$  200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем ( $T_{см}$ ) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру ( в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.